

497413-2026 - Súťaž

Nemecko – Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) – Dual Beam Focused Ion Beam System (FIB) und Transmissionselektronenmikroskop (TEM)

OJ S 136/2026 17/07/2026

**Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii – štandardný režim
Tovary**

1. Kupujúci

1.1. Kupujúci

Úradný názov: Institut für Oberflächen- und Schichttechnik GmbH

E-mail: wahl@ifos.uni-kl.de

Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Organizácia, ktorá zadáva zákazku subvencovanú verejným obstarávateľom

Činnosť verejného obstarávateľa: Vzdelávanie

2. Postup

2.1. Postup

Názov: Dual Beam Focused Ion Beam System (FIB) und Transmissionselektronenmikroskop (TEM)

Opis: Los1: DualBeam Focused Ion Beam Systems (FIB) Gegenstand ist die Lieferung, Installation, Inbetriebnahme sowie betriebsbereite Übergabe eines DualBeam Focused Ion Beam Systems (FIB) einschließlich Einweisung/Schulung und vollständiger Systemdokumentation. Die technischen Mindestanforderungen und Bewertungsaspekte ergeben sich aus den Dokumenten "Los1.25-1696.05.techn.Anforderungsprofil" und "Los1.25-1696.06.Wertungsmatrix". Los2: Transmissionselektronenmikroskop (TEM) Gegenstand ist die Lieferung, Installation, Inbetriebnahme sowie betriebsbereite Übergabe eines Transmissionselektronenmikroskops (TEM) einschließlich Einweisung/Schulung und vollständiger Systemdokumentation. Die technischen Mindestanforderungen und Bewertungsaspekte ergeben sich aus den Dokumenten "Los2.25-1707.05.techn.Anforderungsprofil" und "Los2.25-1707.06.Wertungsmatrix".

Identifikátor postupu: b3e6743d-bfc2-4cac-a001-90b28790bddb

Interný identifikátor: 25-1696-1707

Druh postupu: Verejná súťaž

Postup je zrýchlený: nie

Hlavné prvky postupu: Die Vergabe erfolgt in zwei Losen (Los 1: FIB, Los 2: TEM). Bieter, die Angebote für beide Lose abgeben, können zusätzlich ein Gesamtangebot (Kombinationsangebot) einreichen. Das Kombinationsangebot muss auf den angebotenen Einzel-Angeboten zu beiden Losen basieren; der Leistungsumfang des Kombinationsangebotes muss den Leistungsumfängen der Angebote auf die Einzellöse entsprechen. Das Kombinationsangebot ist zusätzlich zu den losweisen Angeboten einzureichen und muss: - einen gesonderten Gesamtpreis für beide Lose (unter Berücksichtigung etwaiger Preisvorteile, z. B. Rabatte), sowie - eine Darstellung eines etwaigen losübergreifenden wissenschaftlichen, technischen, funktionalen oder organisatorischen Mehrwerts einer gemeinsamen Präparations- und Analytikplattform enthalten. Etwaige Preisvorteile werden ausschließlich im Zuschlagskriterium "Preis" berücksichtigt. Ein losübergreifender Mehrwert wird ausschließlich im Zuschlagskriterium

"Technik" bewertet und setzt voraus, dass dieser über die Bewertung der Einzellose hinausgeht und sich aus dem Zusammenwirken beider Systeme ergibt. Die Bewertung der Kombinationsangebote erfolgt nach denselben Zuschlagskriterien. Zusätzlich werden losübergreifende Aspekte wie die vollständige wissenschaftliche Prozesskette einer Probe - von der Präparation im FIB über den qualitätserhaltenden Proben transfer und die korrelative Untersuchung im TEM bis hin zum gemeinsamen Datenmanagement und der nachvollziehbaren Dokumentation der Untersuchungsergebnisse berücksichtigt. Der Auftraggeber behält sich vor, den Zuschlag entweder losweise oder losübergreifend zu erteilen.

2.1.1. Účel

Druh zmluvy: Tovary

Hlavná klasifikácia (cpv): 38000000 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)

2.1.2. Miesto plnenia

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt (DEB32)

Krajina: Nemecko

2.1.4. Všeobecné informácie

Doplňujúce informácie: #Bekanntmachungs-ID: CXP4DNMMUBY#

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

vgv -

2.1.5. Podmienky verejného obstarávania

Podmienky predkladania:

Maximálny počet častí, za ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuky: 2

Podmienky zmluvy:

Maximálny počet častí, za ktoré môžu byť zmluvy zadané jednému uchádzačovi: 2

2.1.6. Dôvody na vylúčenie

Zdroje dôvodov na vylúčenie: Oznámenie

Porušenie povinností stanovených na základe čisto vnútroštátnych dôvodov vylúčenia:

Účasť v zločineckej organizácii:

Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými činnosťami:

Pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu:

Podvod:

Korupcia:

Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi:

Porušenie povinností platiť dane:

Porušenie povinností platiť príspevky na sociálne zabezpečenie:

Porušenie povinností v oblasti environmentálneho práva:

Porušenie povinností v oblasti sociálneho práva:

Porušenie povinností v oblasti pracovného práva:

Platobná neschopnosť:

Aktíva spravované likvidátorom:

Pozastavené podnikateľské činnosti:

Podobná situácia ako úpadok podľa vnútroštátneho práva:

Závažné odborné pochybenie:

Dohody s inými hospodárskymi subjektmi s cieľom narušiť hospodársku súťaž:

Konflikt záujmov z dôvodu účasti na postupe obstarávania:

Priama alebo nepriama účasť na príprave tohto postupu obstarávania:
Predčasné ukončenie zmluvy, škody alebo iné porovnateľné sankcie:
Nepravdivé informácie, neposkytnutie informácií, neschopnosť predložiť požadované dokumenty alebo získanie dôverných informácií o tomto postupe:

5. Časť

5.1. Časť: LOT-0001

Názov: Dual Beam Focused Ion Beam System (FIB)

Opis: Ziel dieses Beschaffungsvorhabens ist die Lieferung, Installation, Inbetriebnahme sowie betriebsbereite Übergabe eines Dual-Beam-FIB/REM-Systems (Focused Ion Beam / Rasterelektronenmikroskop) einschließlich analytischer Detektorsysteme, Schulung und vollständiger Systemdokumentation. Das System dient primär der präzisen Probenpräparation (u.a. TEM-Lamellen, APT-Spitzen, Querschnitte und Defektfreilegungen) und sekundär der hochauflösenden bildgebenden, chemischen und strukturellen Charakterisierung (SEM, EDX, STEM, EBSD) im selben System. Das Gerät wird als zentrale Präparations- und Analyseplattform für wissenschaftliche Forschungsprojekte eingesetzt. Typische Anwendungen umfassen u. a. Batterie- und Elektrodenmaterialien, Wasserstoffspeichermaterialien, katalytische Schichten, Metalle/Legierungen, keramische Werkstoffe, Halbleiter, Beschichtungen und Multilayer-Systeme. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf: - reproduzierbarer, möglichst automatisierter TEM-Lamellen- und APT-Präparation (Lift-Out, Thinning, Polishing) - 3D-Analytik (Serienschliff/Tomographie) mit quantitativer Auswertung - hochaufgelöster Abbildung in verschiedenen SEM-Modi incl. Ioneninduzierter Sekundärionen sowie korrelierter Bildgebung während der Bearbeitung - chemischer Analytik mittels EDX und kristallographischer Analytik mittels EBSD Darüber hinaus ist eine strukturierte Erfassung und Exportfähigkeit von Messdaten und Metadaten in gängige, nicht-proprietäre Formate erforderlich, um Anforderungen an Nachvollziehbarkeit, Langzeitverfügbarkeit und Forschungsdatenmanagement (FAIR-Prinzipien) zu erfüllen. Das System muss die präzise Probenpräparation und -strukturierung mittels Ionenstrahl sowie die begleitende und nachfolgende Abbildung und Analytik mittels SEM und anderen Detektorsystemen ermöglichen. Ziel ist die reproduzierbare Präparation von Proben für TEM und APT sowie die Durchführung von 2D/3D-Analysen (Bildgebung (SE, STEM), EDX, EBSD) einschließlich vollständiger Dokumentation der Bearbeitungs- und Messparameter. Folgende Kernfunktionen sind zwingend bereitzustellen: 1. Materialabtrag/Strukturierung (manuell und automatisiert) mit definierbaren Pattern- und Rezeptfunktionen. 2. TEM-Lamellenpräparation inkl. In-situ Lift-Out, Thinning und abschließender Feinpolitur. 3. APT-Spitzenpräparation (Needle Milling) inkl. reproduzierbarer Geometrie. 4. Korrelierte Echtzeit-Bildgebung im SEM während der FIB-Bearbeitung (Navigation/Endpunktkontrolle). 5. Chemische Analytik mittels EDX sowie kristallographische Analytik mittels EBSD (Punkt, Linie, Mapping). 6. 3D-Workflows (Serienschliff/Tomographie) mit dokumentierter Rekonstruktion bzw. Export der Datensätze. 7. Workflow und Datenmanagement: eindeutige Zuordnung von Bearbeitungs-/Messdaten, Parametern und Metadaten; Export in nicht proprietäre Formate.

Interný identifikátor: 1

5.1.1. Účel

Druh zmluvy: Tovary

Hlavná klasifikácia (cpv): 38000000 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)

5.1.2. Miesto plnenia

5.1.3. **Predpokladané trvanie**

Iné trvanie: Neznámy

5.1.6. **Všeobecné informácie**

Vyhradená účasť:

Účasť nie je vyhradená.

Je povinné uviesť mená a odbornú kvalifikáciu zamestnancov určených na plnenie zmluvy:

Nevyžaduje sa

Projekt verejného obstarávania úplne alebo čiastočne financovaný z prostriedkov EÚ

Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie

Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP): nie

5.1.7. **Strategické verejné obstarávanie**

Cieľ strategického verejného obstarávania: Žiadne strategické verejné obstarávanie

5.1.9. **Kritériá výberu**

Zdroje výberových kritérií: Oznámenie

Kritérium: Referencie na špecifikované dodávky

Popis výberového kritéria: Eignungskriterium ist die Vorlage von 3 Referenzen zu vergleichbaren Installationen. Bei Angeboten für ein Los sind Referenzen für vergleichbare Systeme des jeweiligen Loses vorzulegen. Bei Angeboten für beide Lose können Referenzen für beide Systemtypen oder vergleichbare integrierte Systeme eingereicht werden. Als vergleichbare Referenzen gelten erfolgreich durchgeführte Liefer-, Installations- und Inbetriebnahmeprojekte von Systemen, die in Art, Funktion und Komplexität dem jeweils angebotenen Los entsprechen (Los 1: DualBeam FIB bzw. vergleichbare FIB/SEM-Systeme; Los 2: TEM bzw. vergleichbare Elektronenmikroskope). Die Referenzen müssen den vollständigen Leistungsumfang (Lieferung, Installation, Inbetriebnahme, betriebsbereite Übergabe sowie Einweisung) umfassen und in einem wissenschaftlichen oder industriellen High-Tech-Umfeld erbracht worden sein. Sie dürfen zum Zeitpunkt des Ablaufs der Angebotsfrist nicht älter als drei Jahre sein.

5.1.10. **Kritériá na vyhodnotenie ponúk**

Kritérium:

Typ: Cena

Názov: Preis (Angebote auf Einzellose und Kombinationsangebote)

Opis: Für das Zuschlagskriterium Preis erhält das Angebot mit dem niedrigsten (gewerteten) Preis 5 Punkte. Null Punkte erhält ein fiktives Angebot mit dem Doppelten des niedrigsten (gewerteten) Angebotspreises. Alle Angebote mit einem Angebotspreis über dem Doppelten des niedrigsten (gewerteten) Angebotspreises erhalten ebenfalls null Punkte. Die Punktbewertung für die dazwischenliegenden Angebotspreise erfolgt über eine lineare Interpunktion mit 4 Stellen hinter dem Komma.

Kategória kritéria na vyhodnotenie ponúk hmotnosť: Váha (percentá, presne)

Číslo kritéria na vyhodnotenie ponúk: 50

Kritérium:

Typ: Kvalita

Názov: Technik (Angebote auf Einzellose bzw. Kombinationsangebote)

Opis: Für das Zuschlagskriterium Technik werden ausschließlich die nachgewiesenen technischen Leistungsparameter von im Dokument 06.Wertungsmatrix Abschnitt 2 (technische Übererfüllung (wertungsrelevant)) des jeweiligen Loses genannten Anforderungen bewertet.

Das Zuschlagskriterium Technik wird ermittelt, indem die Wertungspunkte der einzelnen Anforderungen jeweils mit dem festgelegten Gewichtungsfaktor gemäß Dokument "06. Wertungsmatrix", Abschnitt 2 ("technische Übererfüllung (wertungsrelevant)") des jeweiligen Loses, multipliziert und anschließend aufsummiert werden. Die technische Bewertung eines Kombinationsangebotes setzt sich aus der technischen Bewertung der beiden Einzellose sowie der Bewertung des zusätzlichen wissenschaftlichen und funktionalen Mehrwerts der gemeinsamen Präparations- und Analytikplattform zusammen. Unterkriterien für diesen Mehrwert sind: K1 durchgängiger Probenworkflow zwischen FIB und TEM K2 Qualität des Probentransfers K3 korrelative Wiederauffindbarkeit identischer Probenbereiche K4 gemeinsames Daten- und Projektmanagement K5 gemeinsames Service- und Betriebskonzept Ergänzend wird auf das Dokument "Gesamt.06.Wertungsmatrix.pdf." Kategória kritéria na vyhodnotenie ponúk hmotnosť: Váha (percentá, presne) Číslo kritéria na vyhodnotenie ponúk: 50

5.1.11. Súťažné podklady

Jazyky, v ktorých sú súťažné podklady oficiálne k dispozícii: nemčina
Lehota na vyžiadanie doplňujúcich informácií: 10/08/2026 23:59:59 (UTC+02:00)
východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas
Adresa súťažných podkladov: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4DNMMUBY/documents>
Ad hoc komunikačný kanál:
URL: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4DNMMUBY>

5.1.12. Podmienky verejného obstarávania

Podmienky predkladania:
Elektronické predkladanie: Povinná
Adresa na predkladanie: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4DNMMUBY>
Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky alebo žiadosti o účasť: nemčina
Elektronický katalóg: Nie je povolená
Varianty: Nie je povolená
Uchádzači môžu predložiť viac ako jednu ponuku: Povolená
Lehota na prijímanie ponúk: 17/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas
Doba, počas ktorej musí ponuka zostať platná: 77 Dni
Informácie, ktoré možno doplniť po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk:
Podľa uváženia kupujúceho sa môžu všetky chýbajúce dokumenty týkajúce sa uchádzača predložiť neskôr.
Doplňujúce informácie: Die Vergabestelle behält sich vor, fehlende Angaben und Erklärungen nachzufordern. Ein Anspruch der Bieter besteht nicht (§ 56 VgV). Angebote, die nicht die geforderten oder gegebenenfalls nachgeforderten Erklärungen und Nachweise enthalten, werden nach § 57 Abs. 1 Nr. 2 VgV ausgeschlossen.
Podmienky zmluvy:
Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk: Nie
Elektronická fakturácia: Povolená
Bude sa využívať elektronické objednávanie: nie
Bude sa využívať elektronická platba: nie

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:
Žiadna rámcová dohoda
Informácie o dynamickom nákupnom systéme:

5.1.16. **Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie**

Organizácia pre preskúmanie: Vergabekammer Rheinland-Pfalz, c/o Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Energie und Klima

Informácie o lehotách na preskúmanie: Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Abs. 6 GWB durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. Der Antrag ist unzulässig, soweit - der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt unberührt, - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, - mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB. § 134 Abs. 1 Satz 2 GWB bleibt unberührt.

Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie o postupe verejného obstarávania: Institut für Oberflächen- und Schichttechnik GmbH

Organizácia prijímajúca žiadosti o účasť: Institut für Oberflächen- und Schichttechnik GmbH

5.1. **Časť: LOT-0002**

Názov: Transmissionselektronenmikroskop (TEM)

Opis: Gegenstand des Beschaffungsvorhabens ist die Lieferung, Installation, Inbetriebnahme sowie betriebsbereite Übergabe eines aberrationskorrigierten 200 kV

Transmissionselektronenmikroskops (S/TEM) einschließlich analytischer Detektorsysteme, Schulung und vollständiger Systemdokumentation. Das System dient als zentrale Analyseplattform für die hochauflösende strukturelle, chemische und elektronische Charakterisierung von Materialien auf atomarer und nanometergenauer Skala. Es wird sowohl für industrielle Auftragsanalytik als auch für wissenschaftliche Forschungsprojekte eingesetzt. Im Institut werden Materialien mit stark variierenden Eigenschaften untersucht, insbesondere Metalle, Legierungen, keramische Werkstoffe, Halbleiter, Beschichtungen, funktionale Schichtsysteme sowie nanostrukturierte Materialien. Die Proben unterscheiden sich hinsichtlich Geometrie, Stabilität gegenüber Elektronenstrahlbelastung sowie analytischer Fragestellungen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf: - hochauflösender Abbildung bis in den atomaren Bereich - chemischer Analytik mittels EDX und EELS - Untersuchung von Grenzflächen und Defekten - Untersuchung magnetischer und funktionaler Materialien - reproduzierbaren Messungen über Probenserien hinweg Darüber hinaus ist eine strukturierte Erfassung und Exportfähigkeit von Messdaten und Metadaten in gängige, nicht-proprietäre Formate erforderlich, um Anforderungen an Nachvollziehbarkeit, Langzeitverfügbarkeit und Forschungsdatenmanagement (FAIR-Prinzipien) zu erfüllen. Das System muss die hochauflösende strukturelle, chemische und elektronische Analyse von festen, elektronenstrahlstabilen Proben im Transmissionselektronenmikroskopie- und Raster-Transmissionselektronenmikroskopie-Modus ermöglichen. Hierzu muss es eine präzise

Elektronenoptik, stabile Betriebsbedingungen sowie integrierte analytische Detektionssysteme bereitstellen. Ziel ist die Untersuchung von Materialien bis in den atomaren Maßstab sowie die quantitative und qualitative Analyse von Struktur, Zusammensetzung und elektronischen Eigenschaften. Folgende Kernfunktionen sind zwingend bereitzustellen: 1. Hochauflösende Abbildung (TEM und STEM): - Abbildung von Kristallstrukturen, Defekten, Grenzflächen und Nanostrukturen mit atomarer bzw. sub-nanometergenauer Auflösung. - Betrieb sowohl im konventionellen TEM- als auch im STEM-Modus. - Flexible Wahl geeigneter Abbildungsmodi (z. B. Bright Field, Dark Field, HAADF, ABF, Oberflächenbildgebung mit topografieabhängigem Kontrast). 2. Chemische und spektroskopische Analytik: - Elementanalytik mittels energiedispersiver Röntgenspektroskopie (EDX). - Analyse elektronischer und chemischer Zustände mittels Elektronenenergieverlustspektroskopie (EELS). - Durchführung von Punktanalysen, Linienprofilen sowie zweidimensionalem Mapping. 3. Untersuchung von Grenzflächen und Defekten: - Analyse von Phasengrenzen, Ausscheidungen, Korngrenzen und strukturellen Inhomogenitäten. - Untersuchung lokaler chemischer Variationen auf nanoskaliger Ebene. 4. Untersuchung funktionaler und magnetischer Materialien: - Möglichkeit zur magnetfeldfreien oder feldarmen Abbildung (z. B. Lorentz-Modus oder funktional gleichwertig), soweit erforderlich. 5. Automatisierter und reproduzierbarer Betrieb: - Reproduzierbare Einstellung von Messparametern und Speicherung von Messabläufen. - Unterstützung automatisierter Messreihen und Mapping-Experimente. 6. Workflow und Datenmanagement: - Eindeutige Zuordnung von Messdaten, Parametern und Metadaten. - Möglichkeit zur späteren Reproduktion von Messbedingungen. 7. Integration aller Detektoren und Betriebsmodi in eine konsistente Bedienumgebung.

Interný identifikátor: 2

5.1.1. Účel

Druh zmluvy: Tovary

Hlavná klasifikácia (cpv): 38000000 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)

5.1.2. Miesto plnenia

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt (DEB32)

Krajina: Nemecko

5.1.3. Predpokladané trvanie

Iné trvanie: Neznámy

5.1.6. Všeobecné informácie

Vyhradená účasť:

Účasť nie je vyhradená.

Je povinné uviesť mená a odbornú kvalifikáciu zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa

Projekt verejného obstarávania úplne alebo čiastočne financovaný z prostriedkov EÚ

Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie

Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP): nie

5.1.7. Strategické verejné obstarávanie

Cieľ strategického verejného obstarávania: Žiadne strategické verejné obstarávanie

5.1.9. Kritériá výberu

Zdroje výberových kritérií: Oznámenie

Kritérium: Referencie na špecifikované dodávky

Popis výberového kritéria: Eignungskriterium ist die Vorlage von 3 Referenzen zu vergleichbaren Installationen. Bei Angeboten für ein Los sind Referenzen für vergleichbare Systeme des jeweiligen Loses vorzulegen. Bei Angeboten für beide Lose können Referenzen für beide Systemtypen oder vergleichbare integrierte Systeme eingereicht werden. Als vergleichbare Referenzen gelten erfolgreich durchgeführte Liefer-, Installations- und Inbetriebnahmeprojekte von Systemen, die in Art, Funktion und Komplexität dem jeweils angebotenen Los entsprechen (Los 1: DualBeam FIB bzw. vergleichbare FIB/SEM-Systeme; Los 2: TEM bzw. vergleichbare Elektronenmikroskope). Die Referenzen müssen den vollständigen Leistungsumfang (Lieferung, Installation, Inbetriebnahme, betriebsbereite Übergabe sowie Einweisung) umfassen und in einem wissenschaftlichen oder industriellen High-Tech-Umfeld erbracht worden sein. Sie dürfen zum Zeitpunkt des Ablaufs der Angebotsfrist nicht älter als drei Jahre sein.

5.1.10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium:

Typ: Cena

Názov: Preis (Angebote auf Einzellose und Kombinationsangebote)

Opis: Für das Zuschlagskriterium Preis erhält das Angebot mit dem niedrigsten (gewerteten) Preis 5 Punkte. Null Punkte erhält ein fiktives Angebot mit dem Doppelten des niedrigsten (gewerteten) Angebotspreises. Alle Angebote mit einem Angebotspreis über dem Doppelten des niedrigsten (gewerteten) Angebotspreises erhalten ebenfalls null Punkte. Die Punktbewertung für die dazwischenliegenden Angebotspreise erfolgt über eine lineare Interpunktion mit 4 Stellen hinter dem Komma.

Katégoria kritéria na vyhodnotenie ponúk hmotnosť: Váha (percentá, presne)

Číslo kritéria na vyhodnotenie ponúk: 50

Kritérium:

Typ: Kvalita

Názov: Technik (Angebote auf Einzellose bzw. Kombinationsangebote)

Opis: Für das Zuschlagskriterium Technik werden ausschließlich die nachgewiesenen technischen Leistungsparameter von im Dokument 06.Wertungsmatrix Abschnitt 2 (technische Übererfüllung (wertungsrelevant)) des jeweiligen Loses genannten Anforderungen bewertet. Das Zuschlagskriterium Technik wird ermittelt, indem die Wertungspunkte der einzelnen Anforderungen jeweils mit dem festgelegten Gewichtungsfaktor gemäß Dokument "06. Wertungsmatrix", Abschnitt 2 ("technische Übererfüllung (wertungsrelevant)") des jeweiligen Loses, multipliziert und anschließend aufsummiert werden. Die technische Bewertung eines Kombinationsangebotes setzt sich aus der technischen Bewertung der beiden Einzellose sowie der Bewertung des zusätzlichen wissenschaftlichen und funktionalen Mehrwerts der gemeinsamen Präparations- und Analytikplattform zusammen. Unterkriterien für diesen Mehrwert sind: K1 durchgängiger Probenworkflow zwischen FIB und TEM K2 Qualität des Probentransfers K3 korrelative Wiederauffindbarkeit identischer Probenbereiche K4 gemeinsames Daten- und Projektmanagement K5 gemeinsames Service- und Betriebskonzept Ergänzend wird auf das Dokument "Gesamt.06.Wertungsmatrix.pdf."

Katégoria kritéria na vyhodnotenie ponúk hmotnosť: Váha (percentá, presne)

Číslo kritéria na vyhodnotenie ponúk: 50

5.1.11. Súťažné podklady

Jazyky, v ktorých sú súťažné podklady oficiálne k dispozícii: nemčina

Lehota na vyžiadanie doplňujúcich informácií: 10/08/2026 23:59:59 (UTC+02:00)

východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Adresa súťažných podkladov: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4DNMMUBY/documents>

Ad hoc komunikačný kanál:

URL: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4DNMMUBY>

5.1.12. Podmienky verejného obstarávania

Podmienky predkladania:

Elektronické predkladanie: Povinná

Adresa na predkladanie: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4DNMMUBY>

Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky alebo žiadosti o účasť: nemčina

Elektronický katalóg: Nie je povolená

Varianty: Nie je povolená

Uchádzači môžu predložiť viac ako jednu ponuku: Povolená

Lehota na prijímanie ponúk: 17/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Doba, počas ktorej musí ponuka zostať platná: 77 Dni

Informácie, ktoré možno doplniť po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk:

Podľa uváženia kupujúceho sa môžu všetky chýbajúce dokumenty týkajúce sa uchádzača predložiť neskôr.

Doplňujúce informácie: Die Vergabestelle behält sich vor, fehlende Angaben und Erklärungen nachzufordern. Ein Anspruch der Bieter besteht nicht (§ 56 VgV). Angebote, die nicht die geforderten oder gegebenenfalls nachgeforderten Erklärungen und Nachweise enthalten, werden nach § 57 Abs. 1 Nr. 2 VgV ausgeschlossen.

Podmienky zmluvy:

Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk: Nie

Elektronická fakturácia: Povolená

Bude sa využívať elektronické objednávanie: nie

Bude sa využívať elektronická platba: nie

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žiadna rámcová dohoda

Informácie o dynamickom nákupnom systéme:

Žiadny dynamický nákupný systém

5.1.16. Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie

Organizácia pre preskúmanie: Vergabekammer Rheinland-Pfalz, c/o Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Energie und Klima

Informácie o lehotách na preskúmanie: Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Abs. 6 GWB durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. Der Antrag ist unzulässig, soweit - der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt unberührt, - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis

zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, - mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB. § 134 Abs. 1 Satz 2 GWB bleibt unberührt.

Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie o postupe verejného obstarávania: Institut für Oberflächen- und Schichttechnik GmbH

Organizácia prijímajúca žiadosti o účasť: Institut für Oberflächen- und Schichttechnik GmbH

8. Organizácie

8.1. ORG-0001

Úradný názov: Institut für Oberflächen- und Schichttechnik GmbH

Registračné číslo: UStID DE148647541

Poštová adresa: Trippstadter Straße 120

Mesto: Kaiserslautern

PSČ: 67663

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt (DEB32)

Krajina: Nemecko

E-mail: wahl@ifos.uni-kl.de

Telefón: +49 631205730

Roly tejto organizácie:

Kupujúci

Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie o postupe verejného obstarávania

Organizácia prijímajúca žiadosti o účasť

8.1. ORG-0002

Úradný názov: eureos gmbh steuerberatungsgesellschaft rechtsanwalts-gesellschaft

Registračné číslo: UStID DE267215971

Poštová adresa: Kramergasse 4

Mesto: Dresden

PSČ: 01067

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Dresden, Kreisfreie Stadt (DED21)

Krajina: Nemecko

E-mail: l.moerchen@eureos.de

Telefón: +49 39156286912

Roly tejto organizácie:

Poskytovateľ obstarávacích služieb

8.1. ORG-0003

Úradný názov: Vergabekammer Rheinland-Pfalz, c/o Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Energie und Klima

Registračné číslo: 07-0001801100000-05

Poštová adresa: Stiftsstraße 9

Mesto: Mainz

PSČ: 55116

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Mainz, Kreisfreie Stadt (DEB35)

Krajina: Nemecko

E-mail: vergabekammer.rlp@mwwlw.rlp.de

Telefón: +49 6131162234

Roly tejto organizácie:

Organizácia pre preskúvanie

8.1. ORG-0004

Úradný názov: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registračné číslo: 0204:994-DOEVD-83

Mesto: Bonn

PSČ: 53119

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Krajina: Nemecko

E-mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefón: +49228996100

Roly tejto organizácie:

TED eSender

Informácie o oznámení

Identifikátor/verzia oznámenia: c6abad07-e17d-4e42-b1fc-35d01bf3fcf6 - 01

Typ formulára: Súťaž

Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii – štandardný režim

Podtyp oznámenia: 16

Dátum odoslania oznámenia: 15/07/2026 17:22:32 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Jazyky, v ktorých je toto oznámenie oficiálne k dispozícii: nemčina

Číslo uverejnenia oznámenia: 497413-2026

Číslo vydania série S úradného vestníka: 136/2026

Dátum uverejnenia: 17/07/2026